



第66回 応用物理学会春季学術講演会 メイワフォーシス ランチョンセミナーのご案内

マルチスペクトル・エリプソメーターを使用した エリプソメトリー測定最新動向のご紹介

<講演題目:1>

ランチョンセミナー見どころ FS-1ユーザー様による講演

「ポリマーブラシ表面への液晶アンカリング～ 新規IPS液晶表示モード開発の基礎」

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系応用化学コース

准教授 戸木田 雅利 様

<講演題目:2>

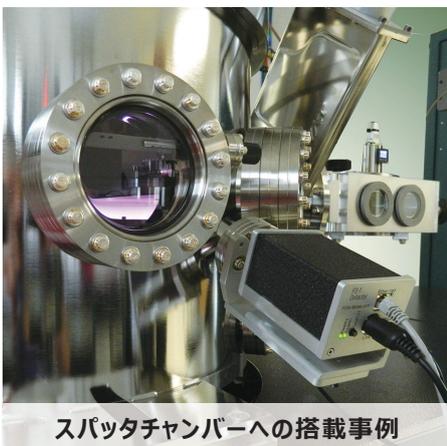
「FS-1 マルチスペクトル・エリプソメーターと最新測定事例のご紹介」

メイワフォーシス株式会社 西村 俊祐

<トピックス>

- 高分子・半導体薄膜のエリプソメーター測定事例
- サブモルレイヤーから多層膜の薄膜測定と解析
- in situ リアルタイムエリプソメトリー計測による膜堆積評価

日 時 3月11日(月曜) 12:30～13:15
会 場 東京工業大学 大岡山キャンパス (西2号館4階W242室)
参加費 無料(お弁当付き) / **定 員** 100名



スパッタチャンバーへの搭載事例

これまでにない!新しいエリプソメーターです!

FS-1マルチスペクトルエリプソメーターは、**非破壊**で高感度に薄膜の膜厚や光学定数を測定します。

特許取得の新**MWE**(Multi-Wavelength Ellipsometer)技術と**4色のLED光**(青 465 nm, 緑 525 nm, 黄 580 nm, 赤 635 nm)を使用することで、高精度な薄膜測定と簡単な測定を実現しました。



meiwafosis.com
メイワフォーシス 株式会社

東京 TEL (03)5379-0051 FAX (03)5379-0811
〒160-0022 新宿区新宿1-14-2 KI御苑前ビル

名古屋 TEL (052)686-4794 FAX (052)686-5114
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-18 PPビル3F

大阪 TEL (06)6674-2222 FAX(06)6674-2323
〒558-0047 大阪市住吉区千鉢2-4-25

仙台 TEL (022)218-0560 FAX (022)218-0561
〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-4-1

テクノロジーラボ 東京都立産業技術研究センター 〒135-0064 東京都江東区青海2-4-10 製品開発支援ラボ318